(19) 日本国特	新庁(JF))	(12) 特	許	公	報(B	2)	(11) 特許番号		
								特許	第 5892	2911号
(45)発行日	平成28	年3月23日(2016.3	3. 23)				(24)登録日] 平成28年3月4	(P50 1日 (20)	8929 11) 16.3.4)
(51) Int.Cl.			FΙ							
BO1J	35/04	(2006.01)	В	01J	35/04	4 :	301G			
B01D	53/94	(2006.01)	В	01J	35/0	4 :	301 J			
F01N	<i>3/2</i> 8	(2006.01)	В	0 1 D	53/9	4 2	222			
			В	0 1 D	53/9	4 2	245			
			F	01N	3/2	8 3	3 O 1 P			
								請求項の数 6	(全	18 頁)
(21) 出願番号	1	特願2012-24830	2 (P2012-24	8302)	(73)特	許権者	000004260			
(22) 出願日		平成24年11月12	日 (2012.11	. 12)		,	株式会社デン	ソー		
(65) 公開番号	}	特開2013-17313	4 (P2013-17	'3134A)		ć	愛知県刈谷市	昭和町1丁目1	番地	
(43) 公開日		平成25年9月5日	(2013.9.5)		(73)特	許権者	000003207			
審査請求	日	平成27年1月7日	(2015.1.7)				トヨタ自動車	株式会社		
(31) 優先権主	三張番号	特願2012-15737	(P2012-157	737)		¢	愛知県豊田市	トヨタ町1番地		
(32) 優先日		平成24年1月27日	E (2012.1.2	27)	(74) 代	理人 🛛	110000648			
(33)優先権主	E張国	日本国(JP)				4	特許業務法人	あいち国際特許	事務所	
					(72)発	明者	林 真大			
						ģ	愛知県刈谷市	昭和町1丁目1	番地	株式会
						1	社デンソー内			
					(72)発	明者	村田雅一			
						<u>ç</u>	愛知県刈谷市	昭和町1丁目1	番地	株式会
						1	社デンソー内			
								最	終頁に	続く

(54) 【発明の名称】 ハニカム構造体

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

格子状に設けられた隔壁(11)と該隔壁(11)に囲まれて形成された複数のセル(12)とを有し、一体成形されたコージェライト製のハニカム構造体(1)であって、 該ハニカム構造体(1)は、軸方向(X)に直交する断面において、中心部から外周部 に向かって径方向にセル密度が段階的に変化するよう構成された2つのセル密度領域(2))を有し、

隣り合う該セル密度領域(2)同士の間には、両者を隔てる境界壁(14)が設けられており、

<u>上記 2 つのセル密度領域(2)の中で</u>最もセル密度が高い高セル密度領域(2 a)と<u>、</u> <u>上記 2 つのセル密度領域(2)の中で最</u>もセル密度が低い低セル密度領域(2 b)とを有 し、

上記2つのセル密度領域(2)のうち、上記高セル密度領域(2a)が最も内側に配置 されており、

上記ハニカム構造体(1)全体を上記高セル密度領域(2 a)で構成したと仮定した場合のハニカム構造体の実体積をV、上記ハニカム構造体(1)の上記高セル密度領域(2 a)の実体積をVa、上記低セル密度領域(2 b)の実体積をVb、上記低セル密度領域(2 b)とそのすぐ内側にある上記セル密度領域(2)との間を隔てる上記境界壁(1 4)の実体積をVsとした場合に、V-Va Vb+Vsの関係を満たすことを特徴とするハニカム構造体(1)。

20

【請求項2】

請求項1に記載のハニカム構造体(1)において、上記実体積V、Va、Vb及びVs は、1 (V-Va)/(Vb+Vs) 1.72の関係を満たすことを特徴とするハニ カム構造体(1)。

【請求項3】

請求項1又は2に記載のハニカム構造体(1)において、上記実体積V、Va、Vb及びVsは、1.2 (V-Va)/(Vb+Vs) 1.58の関係を満たすことを特徴 とするハニカム構造体(1)。

【請求項4】

請求項1~3のいずれか1項に記載のハニカム構造体(1)において、上記高セル密度 10 領域(2a)における上記隔壁(11)の厚みをTa、上記低セル密度領域(2b)にお ける上記隔壁(11)の厚みをTbとした場合に、Ta Tbの関係を満たすことを特徴 とするハニカム構造体(1)。

【請求項5】

請求項1~4のいずれか1項に記載のハニカム構造体(1)において、上記高セル密度 領域(2a)のセル密度をMa、上記低セル密度領域(2b)のセル密度をMbとした場 合に、1 < Ma / Mb < 2の関係を満たすことを特徴とするハニカム構造体(1)。

【請求項6】

請求項1~5のいずれか1項に記載のハニカム構造体(1)において、該ハニカム構造 体(1)の半径をR、上記高セル密度領域(2 a)とそのすぐ外側にある上記セル密度領 ²⁰ 域(2)との間を隔てる上記境界壁(1 4)の半径をrとした場合に、0.2 r/R < 1の関係を満たすことを特徴とするハニカム構造体(1)。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、自動車等の内燃機関の排ガスを浄化するための触媒の担体として用いられる ハニカム構造体に関する。

【背景技術】

[0002]

自動車等の内燃機関の排ガスを浄化するための触媒の担体として、例えば、格子状に設 ³⁰ けられた隔壁とその隔壁に囲まれて形成された複数のセルとを有するハニカム構造体が知 られている。

ハニカム構造体は、排ガスの通路となる排気管内に設置して用いられる。そして、高温の排ガスをハニカム構造体に流通させることにより、ハニカム構造体に担持した触媒を活 性化させ、排ガスの浄化を行う。

【 0 0 0 3 】

近年、自動車等の排ガス規制が厳しくなっていることから、内燃機関の始動直後に発生 する有害物質(コールドエミッション)をより一層低減することが求められている。その ため、ハニカム構造体をできる限り内燃機関の近くに配置し、触媒が活性する温度まで早 く昇温させるといった手段が用いられる。

40

このようなことから、ハニカム構造体には、より高い排ガス浄化性能、より高い耐熱衝 撃性等が要求される。

【0004】

例えば、特許文献1には、中心部と外周部との触媒量、表面積、セル密度等の関係を規 定したハニカム構造体が開示されている。

また、特許文献2には、中心部と外周部との開口率、吸水率等の関係を規定したハニカ ム構造体が開示されている。

また、特許文献3には、第1のセル部(中心部)と第2のセル部(外周部)との間に内 部皮を形成し、第1のセル部と第2のセル部とのセル密度等の関係を規定したハニカム構 造体が開示されている。 [0005]

また、特許文献4には、中心部から外周部に向かって半径方向に形成された半径方向ウェブ(隔壁)の本数が径方向に変化するハニカム構造体が開示されている。

(3)

また、特許文献5には、隔壁が中心から外側に向かって凸状に湾曲した形状であり、中 心部のセル密度が外周部のセル密度よりも小さいハニカム構造体が開示されている。

また、特許文献6には、複数のハニカムセグメントを接合して一体化されてなり、最外 周面を構成しないハニカムセグメントと最外周面を構成するハニカムセグメントとの隔壁 厚さ、セル密度等の関係を規定したハニカム構造体が開示されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

10

20

【0006】 【特許文献1】特開2002-177794号公報 【特許文献2】特開2008-18370号公報 【特許文献3】特許第3219292号公報 【特許文献4】特表2009-532605号公報 【特許文献5】特許第4511396号公報 【特許文献6】特許第4094823号公報 【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[0007]

しかしながら、特許文献1のハニカム構造体では、中心部と外周部とのセル密度の関係 が最適であるとはいえず、排ガス浄化性能を十分に確保することができない。

また、特許文献2のハニカム構造体では、外周部の吸水率や開口率を中心部に比べて大 きくするが、外周部の吸水率を大きくするには、その外周部の気孔径を大きくしたり気孔 そのものを増やしたりする必要がある。そのため、一体成形品として製造しようとすると 、外周部だけ異なる粒子径の原料を用いて押出成形することになり、乾燥や焼成の際に収 縮率差が生じてクラックが発生するおそれがある。また、エミッションの低減を図るため には、排ガスの流通量が多い中央部の気孔率を大きくして軽量化することが望ましいが、 特許文献2のように外周部の気孔率を大きくする必要がある構造では、エミッションの低 減を十分に図ることができない。また、特許文献2における中心部と外周部との開口率(セル密度)の関係も最適であるとはいえず、排ガス浄化性能を十分に確保することができ ない。

【 0 0 0 8 】

また、特許文献3のハニカム構造体では、第1のセル部(中心部)と第2のセル部(外 周部)とのセル密度の関係について記載されておらず、排ガス浄化性能も不明である。 また、特許文献4のハニカム構造体では、半径方向ウェブ(隔壁)の本数が中心部に向

かって減少しているため、高負荷領域(内燃機関が高回転状態)において排ガスが中心部 に集中して流れ、排ガスが十分に浄化されずに吹き抜けてしまい、排ガス浄化性能を十分 に確保することができない。

【 0 0 0 9 】

また、特許文献5のハニカム構造体では、中心部に排ガスが集中して流れやすい構造や 外側へ行くほどセル密度が不均一に低くなる部分が生じる構造となるため、排ガスの流れ を考慮した浄化性能の向上につながるものではなく、そのデータも開示されていない。さ らに、軸方向に直交する断面が楕円形状であるため、長径方向において内側と外側との温 度差が大きくなり、耐熱衝撃性が低下してしまう。

また、特許文献6のハニカム構造体では、複数のセグメントを接合して一体化されているため、接合部分の隔壁の厚みが大きくなり、局所的に熱容量が大きい部分が形成される。これにより、内側と外側との温度差が大きくなり、耐熱衝撃性が低下する場合がある。 【0010】

本発明は、かかる背景に鑑みてなされたもので、排ガス浄化性能を十分に確保しながら 50

30

10

20

、耐熱衝撃性を向上させることができるハニカム構造体を提供しようとするものである。 【課題を解決するための手段】

【0011】

本発明の一の態様は、格子状に設けられた隔壁と該隔壁に囲まれて形成された複数のセ ルとを有し、一体成形されたコージェライト製のハニカム構造体であって、

該ハニカム構造体は、軸方向に直交する断面において、中心部から外周部に向かって径 方向にセル密度が段階的に変化するよう構成された2つのセル密度領域を有し、

隣り合う該セル密度領域同士の間には、両者を隔てる境界壁が設けられており、

<u>上記2つのセル密度領域の中で</u>最もセル密度が高い高セル密度領域と<u>、上記2つのセル</u> 密度領域の中で最もセル密度が低い低セル密度領域とを有し、

上記2つのセル密度領域のうち、上記高セル密度領域が最も内側に配置されており、

上記ハニカム構造体全体を上記高セル密度領域で構成したと仮定した場合のハニカム構造体の実体積をV、上記ハニカム構造体の上記高セル密度領域の実体積をVa、上記低セル密度領域とそのすぐ内側にある上記セル密度領域 との間を隔てる上記境界壁の実体積をVsとした場合に、V-Va Vb+Vsの関係を満たすことを特徴とするハニカム構造体にある(請求項1)。

【発明の効果】

【0012】

上記ハニカム構造体は、軸方向に直交する断面(以下、適宜、径方向断面という)にお いて、中心部から外周部に向かって径方向にセル密度が段階的に変化するよう構成された 複数のセル密度領域を有する。また、隣り合うセル密度領域同士の間には、両者を隔てる 境界壁が設けられている。そして、上記ハニカム構造体全体を高セル密度領域で構成した と仮定した場合のハニカム構造体の実体積をV、上記ハニカム構造体の高セル密度領域の 実体積をVa、低セル密度領域の実体積をVb、低セル密度領域とそのすぐ内側にあるセ ル密度領域との間を隔てる境界壁の実体積をVsとした場合に、V‐Va Vb+Vsの 関係を満たすようにする。これにより、排ガス浄化性能を十分に確保しながら、耐熱衝撃 性を向上させることができる。

【0013】

すなわち、内燃機関を高負荷で回転させた後、回転数を落としてアイドリング状態とした場合、ハニカム構造体は急激に冷やされ、特に排ガスが最も流通する部分はその度合い 30が大きい。そこで、例えば、排ガスが最も流通する部分(例えば中心部)に熱容量の大きい高セル密度領域を、その高セル密度領域の外側に熱容量の小さい低セル密度領域を配置し、上記の実体積の関係(V - Va Vb + Vs)を満たすようにすることで、全体のセル密度を同じとした場合に比べて、内側と外側との間に生じる温度差(以下、適宜、内外温度差という)を抑制することができる。これにより、耐熱衝撃性を向上させることができる。

[0014]

また、セル密度領域同士の間には、両者を隔てる境界壁が設けられている。そのため、 強度を高めることができ、耐熱衝撃性をさらに向上させることができる。

また、ハニカム構造体の内側と外側とでセル密度を調整することにより、内側(例えば 40 中心部)に集中して流れやすい排ガスの流速分布をより均一化することが可能となる。こ れにより、ハニカム構造体全体を有効活用して排ガスの浄化を行うことができ、エミッションの低減を図ることができる。

【0015】

このように、排ガス浄化性能を十分に確保しながら、耐熱衝撃性を向上させることがで きるハニカム構造体を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

[0016]

【図1】実施例における、ハニカム構造体を示す斜視説明図。

【図2】実施例における、実施例E1~E11、E13、E15、E16のハニカム構造 ⁵⁰

体の径方向断面を示す説明図。

【図3】実施例における、実施例E14のハニカム構造体の径方向断面を示す説明図。

【図4】実施例における、参考例E12のハニカム構造体の径方向断面を示す説明図。

【図5】実施例における、ハニカム構造体におけるセルピッチを示す説明図。

【図6】実施例における、比較例C1のハニカム構造体の径方向断面を示す説明図。

【図7】実施例における、比較例C2のハニカム構造体の径方向断面を示す説明図。

【図8】実施例における、ハニカム構造体を備えた触媒コンバータを示す説明図。

【図9】実施例における、(V - V a) / (V b + V s)の値と温度差 T 比との関係を 示したグラフ。

10 【図10】実施例における、セル密度比Ma/Mbとエミッション比との関係を示したグ ラフ。

【図11】実施例における、ハニカム構造体の中心からの距離と流速との関係を示したグ ラフ。

【図12】実施例における、境界壁位置 r / Rとエミッション比との関係を示したグラフ

【発明を実施するための形態】

[0017]

上記ハニカム構造体は、上述のとおり、軸方向に直交する断面において、中心部から外 周部に向かって径方向にセル密度が段階的に変化するよう構成された複数のセル密度領域 を有する。すなわち、ハニカム構造体は、中心部から外周部に向かって径方向に複数の領 域(セル密度領域)に分割されており、各セル密度領域内のセル密度は一定となっている 。また、隣り合うセル密度領域のセル密度は異なっており、径方向においてセル密度が段 階的に変化するよう構成されている。

[0018]

また、上記高セル密度領域は、最も外側のセル密度領域を除いた中で最もセル密度が高 いセル密度領域である。また、上記低セル密度領域は、最も内側のセル密度領域を除いた 中で最もセル密度が低いセル密度領域である。したがって、ハニカム構造体が内側(中心 部)と外側(外周部)との2つのセル密度領域を有する場合、必然的に内側が高セル密度 領域、外側が低セル密度領域となる。

30 また、上記実体積Vは、上記ハニカム構造体全体を高セル密度領域で構成したと仮定し た場合のハニカム構造体の実体積である。すなわち、高セル密度領域のみからなる一様な ハニカム構造体を仮定した場合、そのハニカム構造体の実体積である。

[0019]

また、上記実体積V、Va、Vb及びVsの関係がV-Va<Vb+Vsである場合に は、例えば、排ガスが最も流通する部分(例えば中心部)に高セル密度領域を、その高セ ル密度領域の外側に低セル密度領域を配置しても、外側の熱容量が大きくなり、保温性が 高くなってしまうことがある。そのため、急冷時の内外温度差を十分に抑制することがで きず、耐熱衝撃性が低下してしまう。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

40 また、上記実体積 V、 V a、 V b 及び V s は、 1 (V - V a) / (V b + V s) 1 .72の関係を満たす構成とすることができる(請求項2)。

さらに、上記実体積 V、 V a 、 V b 及び V s は、 1 . 2 (V - V a) / (V b + V s 1.58の関係を満たす構成とすることができる(請求項3)。

この場合には、急冷時の内外温度差を抑制して耐熱衝撃性を向上させるという効果を十 分に発揮することができる。

[0021]

上記実体積 V、 V a 、 V b 及び V s の関係が(V - V a) / (V b + V s) > 1 . 7 2 である場合には、例えば、排ガスが最も流通する部分(例えば中心部)に高セル密度領域 を、その高セル密度領域の外側に低セル密度領域を配置したときに、外側のセル密度が低 くなり、外側に排ガスが流れやすくなってしまうことがある。そのため、急冷時に外側の

温度のみが低くなり、内側は保温されてしまうことから、急冷時の内外温度差が生じやす くなるおそれがある。

【0022】

また、上記高セル密度領域における上記隔壁の厚みをTa、上記低セル密度領域における上記隔壁の厚みをTbとした場合に、Ta Tbの関係を満たす構成とすることができる(請求項4)。

この場合には、各セル密度領域のセル密度を調整しながら、ハニカム構造体全体の強度 を十分に確保することができる。これにより、耐熱衝撃性をさらに向上させることができ る。

[0023]

10

20

なお、上記高セル密度領域における上記隔壁の厚みTaは、例えば、30~120µm とすることができる。また、上記低セル密度領域における上記隔壁の厚みTbは、例えば 、50~200µmとすることができる。

【0024】

また、上記高セル密度領域のセル密度をMa、上記低セル密度領域のセル密度をMbとした場合に、1<Ma/Mb<2の関係を満たす構成とすることができる(請求項5)。 この場合には、エミッションの低減を図って排ガス浄化性能を確保するという効果を十分に発揮することができる。

また、より高い排ガス浄化性能を得るために、Ma/Mbの値を1.25~1.5とす ることが望ましい。

[0025]

上記セル密度Ma及びMbの関係がMa/Mb 1である場合には、各セル密度領域の セル密度を調整してエミッションの低減を図り、排ガス浄化性能を確保するという上述の 効果を十分に発揮することができないおそれがある。

一方、上記セル密度Ma及びMbの関係がMa/Mb 2である場合には、例えば、排 ガスが最も流通する部分(例えば中心部)に高セル密度領域を、その高セル密度領域の外 側に低セル密度領域を配置したときに、外側のセル密度が低くなり、外側に排ガスが流れ やすくなってしまうことがある。そのため、排ガスが十分に浄化されずに通過する、いわ ゆる吹き抜けが生じ、排ガス浄化性能が低下してしまうおそれがある。

【0026】

30

なお、上記高セル密度領域のセル密度Maは、例えば、62~186個/cm²とする ことができる。また、上記低セル密度領域のセル密度Mbは、例えば、46.5~139 .5個/cm²とすることができる。

【0027】

また、上記ハニカム構造体の半径をR、上記高セル密度領域とそのすぐ外側にある上記 セル密度領域との間を隔てる上記境界壁の半径をrとした場合に、0.2 r/R<1の 関係を満たす構成とすることができる(請求項6)。

この場合には、エミッションの低減を図って排ガス浄化性能を確保するという効果を十 分に発揮することができる。

また、より高い排ガス浄化性能を得るために、r/Rの値を0.5~0.8とすること ⁴⁰が望ましい。

[0028]

なお、上記ハニカム構造体の半径 R 及び上記境界壁の半径 r は、ハニカム構造体の軸方向(ガス流路方向)に直交する断面におけるハニカム構造体の半径及び境界壁の半径である。

また、上記半径 R、 r とは、ハニカム構造体や境界壁の形状が円形状である場合にはその半径、多角形状である場合にはその内接円の半径とする。

【0029】

また、上記複数のセル密度領域のうち、上記高セル密度領域が最も内側に配置されている。_

<u>それゆえ</u>、排ガスが最も流通する部分(例えば中心部)に表面積の大きい高セル密度領 域を配置することになるため、エミッションの低減を図って排ガス浄化性能を確保すると いう効果を十分に発揮することができる。また、必然的に、高セル密度領域の外側に低セ ル密度領域が配置されることになるため、急冷時の内外温度差を抑制して耐熱衝撃性を向 上させるという効果を十分に発揮することができる。

なお、上記構成の場合、高セル密度領域の中心軸は、ハニカム構造体の中心軸と必ずし も一致した位置とする必要はない。高セル密度領域の位置は、例えば、ハニカム構造体を 配置する排気管の形状や排ガスの流れ等によって様々な位置に設定することができる。 【0030】

また、上記ハニカム構造体は、2つのセル密度領域を有し、内側(中心部)に高セル密 ¹⁰ 度領域を配置し、外側(外周部)に低セル密度領域を配置する構成とすることができる。 この場合には、エミッションの低減を図って排ガス浄化性能を確保するという効果と、

急冷時の内外温度差を抑制して耐熱衝撃性を向上させるという効果とを十分に発揮するこ とができる。

【0031】

また、上記ハニカム構造体は、3つ以上のセル密度領域を有し、径方向においてセル密 度が段階的に低くなる構成とすることができる。

この場合には、急冷時の内外温度差を抑制して耐熱衝撃性を向上させるという効果をよ り一層高めることができる。

ただし、このような構成とした場合、最も外側のセル密度領域のセル密度が低くなりす 20 ぎてハニカム構造体の強度(アイソスタティック強度等)が低下するおそれがある。そこ で、最も外側のセル密度領域のセル密度を高くして、ハニカム構造体の強度を確保するこ とが望ましい。

【0032】

また、上記ハニカム構造体は、例えば、触媒によって排ガスを浄化する触媒コンバータ 等に用いられる。この場合、上記ハニカム構造体の上記隔壁の表面に排ガス浄化用の触媒 を担持して用いられる。

また、上記ハニカム構造体の気孔率は、例えば、10~70%とすることができる。 【0033】

また、上記セルの形状は、径方向断面において、例えば、円形、多角形(例えば、四角 ³⁰ 形、六角形)等とすることができる。

また、上記セル密度領域の外形形状は、径方向断面において、例えば、円形、多角形等 とすることができる。

また、上記境界壁の厚みは、例えば、20~250μmとすることができる。また、上 記境界壁の形状は、径方向断面において、例えば、円形、多角形等とすることができる。 【実施例】

【0034】

本例では、実施例としての複数のハニカム構造体(実施例<u>E1~E11、E13~E1</u> <u>6</u>)、参考例としてのハニカム構造体(参考例E12)</u>及び比較例としての複数のハニカ ム構造体(比較例C1~C3)を作製し、これらについて耐熱衝撃性、排ガス浄化性能の⁴⁰ 評価を行った。

【 0 0 3 5 】

まず、実施例としてのハニカム構造体(実施例<u>E1~E11、E13~E16</u>)<u>、及び</u> 参考例としてのハニカム構造体(参考例E12)について、図を用いて説明する。

図1~図4に示すごとく、ハニカム構造体1は、格子状に設けられた隔壁11と隔壁1 1に囲まれて形成された複数のセル12とを有し、一体成形されたコージェライト製のハ ニカム構造体である。また、ハニカム構造体1は、軸方向Xに直交する断面において、中 心部から外周部に向かって径方向にセル密度が段階的に変化するよう構成された複数のセ ル密度領域2を有する。隣り合うセル密度領域2同士の間には、両者を隔てる境界壁14 が設けられている。 ~~

[0036]

同図に示すごとく、複数のセル密度領域2は、最も外側のセル密度領域2を除いた中で 最もセル密度が高い高セル密度領域2 aと、最も内側のセル密度領域2 を除いた中で最も セル密度が低い低セル密度領域2 bとを有する。また、ハニカム構造体1 全体を高セル密 度領域2 aで構成したと仮定した場合のハニカム構造体の実体積をV、ハニカム構造体1 の高セル密度領域2 aの実体積をVa、低セル密度領域2 bの実体積をVb、低セル密度 領域2 bとそのすぐ内側にあるセル密度領域2 との間を隔てる境界壁14(14b)の実 体積をVsとした場合に、V-Va Vb+Vsの関係を満たす。

(8)

以下、これを詳説する。

【0037】

10

図1に示すごとく、ハニカム構造体1(実施例<u>E1~E11、E13~E16</u>)は、排 ガス浄化用の触媒の担体として用いられるものであり、四角形格子状に設けられた隔壁1 1と、その隔壁11に囲まれて形成された四角形状の複数のセル12と、外周側面を覆う 円筒状の外周壁13とを有する。また、ハニカム構造体1は、コージェライト製であり、 全体を一体的に成形したものである。また、ハニカム構造体1の寸法は、直径が103m m、長さが105mmである。

【0038】

図2、図3に示すごとく、実施例E1~E11、E13~E16のハニカム構造体1は、軸方向X(図1)に直交する断面において、中心部から外周部に向かって径方向に2つのセル密度領域2(第1セル密度領域21、第2セル密度領域22)に分割されている。 各セル密度領域2内のセル密度は一定となっている。また、隣り合うセル密度領域2のセル密度は異なっており、径方向においてセル密度が段階的に変化するよう構成されている

20

30

[0039]

同図に示すごとく、第1セル密度領域21は、上述の高セル密度領域2aに該当し、ハ ニカム構造体1の中心部であって最も内側に配置されている。また、第2セル密度領域2 2は、上述の低セル密度領域2bに該当し、ハニカム構造体1の外周部であって最も外側 に配置されている。

なお、図2(a)に示すハニカム構造体1では、第1セル密度領域21と第2セル密度 領域22とのセル12の向きは同じであるが、例えば、図2(b)に示すハニカム構造体 1のように、セル12の向きが異なる(第2セル密度領域22のセル12が第1セル密度 領域21のセル12に対して45°傾いている)構成とすることもできる。

[0040]

図4に示すごとく、参考例E12のハニカム構造体1は、軸方向X(図1)に直交する 断面において、中心部から外周部に向かって径方向に3つのセル密度領域2(第1セル密 度領域21、第2セル密度領域22、第3セル密度領域23)に分割されている。各セル 密度領域2内のセル密度は一定となっている。また、隣り合うセル密度領域2のセル密度 は異なっており、径方向においてセル密度が段階的に変化するよう構成されている。 【0041】

第1セル密度領域21は、ハニカム構造体1の中心部であって最も内側に配置されてい 40 る。また、第2セル密度領域22は、上述の低セル密度領域2bに該当し、第1セル密度 領域21のすぐ外側に配置されている。また、第3セル密度領域23は、セル密度が第1 セル密度領域21よりも低く、第2セル密度領域22よりも高い。また、第2セル密度領 域22のすぐ外側であって、ハニカム構造体1の最も外側に配置されている。このように 、最も外側に最もセル密度が低いセル密度領域2が配置されないようにすることで、ハニ カム構造体1の強度(アイソスタティック強度等)を確保している。

【0042】

また、図2~図4に示すごとく、ハニカム構造体1(実施例<u>E1~E11、E13~E</u> <u>16</u>)において、高セル密度領域2a(第1セル密度領域21)における隔壁11の厚み をTa、低セル密度領域2b(第2セル密度領域22)における隔壁11の厚みをTbと

した場合に、Ta Tbの関係を満たしている。

また、ハニカム構造体1(実施例E1~E4、E6、E8<u>~E11、E13~</u>E15) において、高セル密度領域2a(第1セル密度領域21)のセル密度をMa、低セル密度 領域2b(第2セル密度領域22)のセル密度をMbとした場合に、1<Ma/Mb<2 の関係を満たしている。

なお、各ハニカム構造体1(実施例<u>E1~E11、E13~E16</u>)における各セル密 度領域2(第1セル密度領域21、第2セル密度領域22、第3セル密度領域23)の隔 壁の厚み(mm)、セル密度(個/cm²)、気孔率(%)、セル密度比Ma/Mbは、 表1、表2に示すとおりである。

【0043】

ここで、各セル密度領域2のセル密度の測定方法について説明する。セル密度は、ハニ カム構造体の径方向断面において、図5(a)、(b)に示すごとく、セルピッチPを工 具顕微鏡やマイクロスコープ等を用いて測定し、後述する関係式に代入してセル密度(c psi)を算出する。本例では、マイクロスコープ(キーエンス社製、VHX-900) を用いて各セル密度領域2のセルピッチPを5点ずつ測定し、その平均値を平均セルピッ チとする。ここで、セル密度の単位「cpsi」は、1平方インチ当たりのセルの個数を 表す。なお、表1、表2では、セル密度の単位「cpsi」を「個/cm²」に変換して 表示している。

【0044】

例えば、図 5 (a)に示すごとく、実施例<u>E1~E11、E13~E16</u>のハニカム構 ²⁰ 造体1のように、セル12の形状が四角形の場合には、平均セルピッチをp1とすると、 セル密度(cpsi)=(25.4/p1)²の関係式からセル密度を算出する。

また、図5(b)に示すごとく、セル12の形状が六角形の場合には、平均セルピッチをp2とすると、セル密度(cpsi)=(2/ 3)×(25.4/p2)²の関係式からセル密度を算出する。

【0045】

また、図2~図4に示すごとく、ハニカム構造体1(実施例<u>E1~E11、E13~E</u> <u>16</u>)において、隣り合うセル密度領域2同士の間には、両者を隔てる筒状の境界壁14 が設けられている。境界壁14の形状は、実施例E14のハニカム構造体1(図3)が八 角形状であり、それ以外のハニカム構造体1(図2、図4)が円形状である。

30

40

10

また、ハニカム構造体1の半径をR、高セル密度領域2a(第1セル密度領域21)と そのすぐ外側にあるセル密度領域2(第2セル密度領域22)との間を隔てる境界壁14 の半径をrとした場合に、0.2 r/R<1の関係を満たしている。ここで、実施例E 14のハニカム構造体1は境界壁14が八角形状であるため、その内接円の半径がrであ る。

なお、各ハニカム構造体 1 (実施例<u>E1~E11、E13~E16</u>)の境界壁の厚み(mm)、境界壁位置r/Rの値は、表 1、表 2 に示すとおりである。 【0046】

また、同図に示すごとく、ハニカム構造体1(実施例<u>E1~E11、E13~E16</u>) において、ハニカム構造体1全体を高セル密度領域2aで構成したと仮定した場合のハニ カム構造体の実体積をV、ハニカム構造体1の高セル密度領域2a(第1セル密度領域2 1)の実体積をVa、低セル密度領域2b(第2セル密度領域22)の実体積をVb、低 セル密度領域2b(第2セル密度領域22)とそのすぐ内側にあるセル密度領域2(第1 セル密度領域21)との間を隔てる境界壁14(14b)の実体積をVsとした場合に、 V-Va Vb+Vsの関係を満たす。すなわち、(V-Va)/(Vb+Vs) 1の 関係を満たす。

なお、各ハニカム構造体1(実施例<u>E1~E11、E13~E16</u>)の(V-Va)/ (Vb+Vs)の値は、表1、表2に示すとおりである。 【0047】

ここで、円筒形状のハニカム構造体1において、実体積V、Va、Vb及びVsは、上 ⁵⁰

述したように、ハニカム構造体1の半径をR、境界壁14の半径をrとし、さらにハニカム構造体1の軸方向長さをL、境界壁14の厚みをtsとした場合、下記の計算式により 求めることができる。なお、下記の計算式中の「OFA」とは、「Open Front al Area」の略であり、セル12の開口率を表す。

(10)

V = × R² × L × (1 - <u>高セル密度領域の</u>OFA / 100) × (1 - <u>高セル密度領域</u> の気孔率 / 100)

Va = x(r - ts / 2)² x L x (1 - 高セル密度領域のOFA / 100) x (1
 - 高セル密度領域の気孔率 / 100)

Vb = {R²-(r+ts/2)²}× ×L×(1-低セル密度領域のOFA/100) ×(1-低セル密度領域の気孔率/100)

Vs={ x(r+ts/2)²xL}-{ x(r-ts/2)²xL}x(1-境界 壁の気孔率/100)

【0048】

次に、比較例としてのハニカム構造体9(比較例C1~C3)について、図を用いて説 明する。

図6、図7に示すごとく、比較例C1、C2のハニカム構造体9は、上述した実施例<u>E</u> <u>1~E11、E13~E16</u>のハニカム構造体1と異なり、1つのセル密度領域(表1、 表2では、第1セル密度領域として表示)のみで構成されている。すなわち、全体のセル 密度が一定である。また、比較例C1のハニカム構造体9(図6)は、比較例C2のハニ カム構造体9(図7)よりもセル密度が低い。その他の基本的な構成は、上述した実施例 E1~E11、E13~E16のハニカム構造体1と同様である。

【0049】

また、比較例 C 3 のハニカム構造体は、上述の実体積 V 、 V a 、 V b 及び V s の関係が (V - V a) / (V b + V s) < 1 である。その他の基本的な構成は、上述した実施例<u>E</u> 1 ~ E 1 1 、 E 1 3 ~ E 1 6 のハニカム構造体 1 と同様である。

なお、各ハニカム構造体 9 (比較例 C 1 ~ C 3)の隔壁の厚み (mm)、セル密度 (個 / c m²)、気孔率 (%)等は、表 1 、表 2 に示すとおりである。

【 0 0 5 0 】

次に、ハニカム構造体(実施例<u>E1~E11、E13~E16、参考例E12</u>、比較例 C1~C3)の製造方法について説明する。

30

40

ハニカム構造体を製造するに当たっては、まず、セラミックス原料を準備する。セラミックス原料の原料粉末としては、カオリン、溶融シリカ、水酸化アルミニウム、アルミナ、タルク、カーボン粒子等を含有し、化学組成が重量比にて最終的にSiO₂:45~55%、Al₂O₃:33~42%、MgO:12~18%となるコージェライトを主成分とする組成となるように調整したものを用いた。この原料粉末に水、バインダ等を所定量添加し、混錬することでセラミックス原料を得る。

【0051】

次いで、押出成形用金型を用いてセラミックス原料を押出成形し、ハニカム成形体を成 形する。このとき、隔壁の形状に対応する形状のスリット溝を有する押出成形用金型を用 いて押出成形を行う。そして、成形したハニカム成形体をマイクロ波により乾燥させ、所 望の長さに切断する。その後、ハニカム成形体を所定の温度(例えば、最高温度:139 0~1430)で焼成する。

これにより、ハニカム構造体を得る。

【 0 0 5 2 】

次に、各ハニカム構造体(実施例<u>E1~E11、E13~E16、参考例E12</u>、比較 例C1~C3)の耐熱衝撃性、排ガス浄化性能について評価を行う。以下、耐熱衝撃性、 排ガス浄化性能の評価方法について説明する。

【0053】

耐熱衝撃性の評価は、図8に示すごとく、ハニカム構造体1(9)をアルミナマット8 1で巻いた状態で排気管82内に設置し、触媒コンバータ8を構成する。このとき、ハニ ⁵

10

カム構造体1(9)には、予め排ガス浄化用の触媒を担持させておく。触媒としては、例 えば、三元触媒として貴金属である白金(Pt)、ロジウム(Rh)、パラジウム(Pd)の少なくとも1種を含有し、 アルミナを含有したもの、さらにセリア等の酸素吸蔵剤 を含有したもの等を用いることができる。また、ハニカム構造体1(9)には、軸方向X の中間位置に2つの熱電対H1、H2を設置しておく。一方の熱電対H1は、軸方向Xに 直交する断面の中心(中心軸の位置)に設置する。他方の熱電対H2は、外周から内側へ 直径の1割に相当する距離の位置に設置する。

【0054】

次いで、触媒コンバータ8をエンジン(V型8気筒、4.3L)に搭載し、WOT(W ide open throttle)で走行する。そして、ハニカム構造体1(9)の 中心部(熱電対H1)が所定の温度(1050)となるようにし、その状態で所定の時 間(5分)維持する。その後、エンジンの回転数を落としてアイドリング状態とし、ハニ カム構造体1(9)を急冷する。この急冷時に発生するハニカム構造体1(9)の中心部 (熱電対H1)と外周部(熱電対H2)との温度差 T()を測定する。本例では、比 較例C2の温度差 T()を基準とし、温度差 T比を求める。

【 0 0 5 5 】

また、排ガス浄化性能の評価は、ハニカム構造体をエンジンに搭載して10万km走行 したのと同等に担持した触媒を劣化させたハニカム構造体を準備し、これをエンジンのS /C(Start Catalyst)位置に搭載する。また、電気炉で加熱して触媒が 十分に劣化されたハニカム構造体をエンジンのUF/C(Underfroor Cat alyst)位置に搭載する。そして、所定のモード(LA 4評価モード)で走行し、 排出されるエミッション(HC、CO、NO×)量を測定する。本例では、比較例C2の エミッション量を基準とし、エミッション比を求める。

20

10

ここで、S/C位置とは、エンジンからの排ガスが流通する排ガス流路において、エンジンの排気口の直後の位置(排ガス流路の上流側の位置)である。また、UF/C位置とは、排ガスの流路において、S/C位置のさらに下流側の車両の床下に当たる位置(排ガス流路の下流側の位置)である。

[0056]

【表1】

(表1)											
			比較例					実施例			
		C1	C2	C3	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7
	隔壁厚み(mm)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
第1セル 密度領域	セル密度(個/cm ²)	62.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0
	気孔率(%)	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
	隔壁厚み(mm)	ļ		0.11	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09
第2セル 密度領域	セル密度(個/cm ²)	I	1	62.0	62.0	62.0	46.5	46.5	38.8	62.0	31.0
	気孔率(%)	1	I	33	33	33	33	33	33	33	33
境界	壁厚み(mm)	1	1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.05
境界	壁位置r/R	I	I	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77
セルを	情度比Ma/Mb	I	1	1.5	1.5	1.5	2	2	2.4	1.5	3
(V-V)	a)/(Vb+Vs)	ł	1	0.94	1.17	1.05	1.08	1.35	1.47	1.19	1.69
温息	度差 Δ T 比	I	1	1.02	0.96	0.98	0.97	0.93	0.935	0.95	0.97
H	シション比	1.13	1		0.7	ł		0.99	ŀ		1

【0057】

JP 5892911 B2 2016.3.23

10

20

30

(表2)													
			比較例			実加	百何		参考例		実加	臣例	
		C1	C2	C3	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16
	隔壁厚み(mm)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
第1セル 密度領域	セル密度(個/cm ²)	62.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0
	気孔率(%)	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
	隔壁厚み(mm)	I	-	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
第2セル 密度領域	セル密度(個/cm ²)	I	1	62.0	74.4	49.6	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	58.9	31.0
	気孔率(%)	I	I	33	33	33	33	33	33	26	33	33	33
	隔壁厚み(mm)	I	I	Ι	I	1	I	-	0.09	I	I	I	I
第3セル 密度領域	セル密度(個/cm ²)	I	1	1	1	1	I	I	11	I	I	I	- 1
	気孔率(%)	1	I	I	I	I	I	Ι	33	I	I	I	I
境界	壁厚み(mm)	1	I	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
境界	壁位置r/R	. 1	1	0.77	0.77	0.77	0.6	0.53	11	0.77	0.77	0.77	0.77
セル窑	清度比Ma/Mb	I	I	1.5	1.25	1.875	1.5	1.5		1.5	1.5	1.58	3
V-V	(a)/(Vb+Vs)	I	1	0.94	1.08	1.31	1.19	1.06	11	1.17	1.17	1.21	1.63
温度	莨差 Δ T 比	I	1	1.02	I	-	l	0.975	0.97	0.97	0.96	0.925	0.928
Ϋ́Η	ッション比	1.13	1	I	0.85	0.92	0.67	0.69	I	-	I	I	I

10

20

30

40

【0058】

次に、耐熱衝撃性、排ガス浄化性能の評価結果を表1、表2に示す。

表1、表2からわかるように、実施例<u>E1~E11、E13~E16</u>のハニカム構造体 は、(V-Va)/(Vb+Vs) 1であり、温度差 T比やエミッション比が1未満 であった。

具体的には、実施例E1~E7、E11~E16のハニカム構造体は、全体のセル密度 ⁵⁰

(13)

(14)

が一定である比較例C2、(V-Va)/(Vb+Vs)<1である比較例C3に比べて、温度差 Tを小さくすることができ、急冷時の内外温度差を抑制することができる。また、実施例E1、E4、E8~E11のハニカム構造体は、全体のセル密度が一定である 比較例C1、C2に比べて、エミッション量を低減することができる。

以上の結果から、実施例<u>E1~E11、E13~E16</u>のハニカム構造体は、耐熱衝撃 性や排ガス浄化性能に優れていることがわかった。

【 0 0 5 9 】

また、図9は、表1及び表2の結果をもとに、(V - V a) / (V b + V s)の値と温 度差 T比との関係を示したものである。同図には、実施例E1~E7、E11<u>、E13</u> ~E16、比較例C3の温度差 T比がプロットされている。

10

同図からわかるように、1 (V - V a) / (V b + V s) 1 . 7 2 とすることにより、温度差 Tを確実に小さくする(温度差 T比を1未満とする)ことができ、耐熱衝撃性を高めることができる。特に、実施例E4、E5、E15、E16のように1.2 (V - V a) / (V b + V s) 1.63とすることにより、さらには実施例E4、E5、E15のように、1.2 (V - V a) / (V b + V s) 1.58とすることにより、その効果をより一層高めることができる。

[0060]

また、図10は、表1及び表2の結果をもとに、セル密度比Ma/Mbとエミッション 比との関係を示したものである。同図には、実施例E1、E4、E8、E9、比較例C2 のエミッション比がプロットされている。ここで、比較例C2は、セル密度比Ma/Mb =1としている。

20

30

同図からわかるように、1 < Ma / Mb < 2 とすることにより、エミッション量を確実 に低減する(エミッション比を1未満とする)ことができ、排ガス浄化性能を高めること ができる。また、1 . 2 5 Ma / Mb 1 . 5 とすることにより、エミッション量をよ り低減することができ、排ガス浄化性能をさらに高めることができる。 【0061】

また、図11は、ハニカム構造体の中心からの距離と流速との関係を示したものである。同図には、実施例E1、E8、E9、比較例C2の流速比がプロットされている。

ここで、流速の測定方法について説明する。図8を参照のごとく、排ガス浄化用の触媒 を担持したハニカム構造体1(9)をアルミナマット81で巻いた状態で排気管82内に 設置し、触媒コンバータ8を構成する。また、ハニカム構造体の下流側には、流速計(図 示略)を設置しておく。次いで、ハニカム構造体1(9)に所定量の空気を流通させ、ハ ニカム構造体1(9)を通過した直後の空気の流速を流速計にて測定する。

同図からわかるように、実施例E1、E8、E9のハニカム構造体は、セル密度比Ma / Mbの調整により、比較例C2のハニカム構造体に比べて内側と外側とにおける流速の ばらつきを小さくすることができる。すなわち、流速分布をより均一化することができる 。これにより、エミッション量を低減し、排ガス浄化性能を高めることができる。 【0062】

また、図12は、表1及び表2の結果をもとに、境界壁位置r/Rとエミッション比との関係を示したものである。同図には、実施例E1、E10、E11、比較例C1、C2 40 のエミッション比がプロットされている。ここで、比較例C1は、実施例E1、E10、 E11とセル密度が異なるため、境界壁位置r/R=0としている。また、比較例C2は 、実施例E1、E10、E11とセル密度が同じであるため、境界壁位置r/R=1とし ている。

同図からわかるように、0.2 r/R<1とすることにより、エミッション量を確実 に低減する(エミッション比を1未満とする)ことができ、排ガス浄化性能を高めること ができる。また、0.5 r/R 0.8とすることにより、エミッション量をより低減 することができ、排ガス浄化性能をさらに高めることができる。 【符号の説明】 【0063】

- 1 ハニカム構造体
- 11 隔壁
- 12 セル
- 14 境界壁
- 2 セル密度領域
- 2 a 高セル密度領域
- 2 b 低セル密度領域



(図1)







14(14b)

2 (21)



【図4】





(a)















(図8)









(図10)

【図12】 (図12)









フロントページの続き

- (72)発明者 松原 浩之愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内
- (72)発明者 久野 央志
 愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社内
 (72)発明者 鈴木 宏昌
 - 愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社内

審査官 磯部 香

(56)参考文献 特開2008-018370(JP,A) 特開2002-177794(JP,A) 特開平04-332604(JP,A) 特開2003-254034(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

B 0 1 J	35/04
B 0 1 D	53/94
F 0 1 N	3/28